Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/780,308	SHIH ET AL.
Examiner	Art Unit
Djenane M. Bayard	2141

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
709	225	. 10/4/2005	DB
719	249	10/4/2005	DB
-			

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
·	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

(INCLODING O	EARCH STRATEGY	<u>'</u>
	DATE	EXMR
East	10/5/2005	DB
	·	
		-
:		
	·	